

PCIe SSD Tester (ダイチューテクノロジーズ)

Model D050-NVMe 製品仕様

小型軽量の筐体でPCIe SSDの試験、解析がデスク上で可能で4Cellの試験が同時に行えます。
PCIe Gen3 (x8 Lane)インタフェースの超高速SSDに対応しています。

● 製品本体



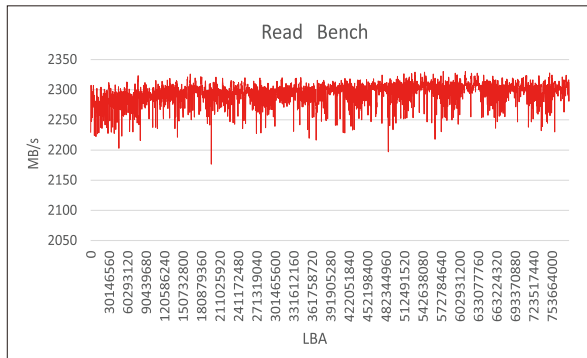
● 試験機能

試験項目	試験内容
S.M.A.R.T 情報取得	SSDの状態を解析
ライト・リード・コンペアー	ライト・リード コンペアーで不良判定
ライト / リード ベンチ	シーケンシャル / ランダムアクセス測定
IOPS測定	シーケンシャル / ランダムIOPS測定
データ消去	全エリアゼロクリアー
パフォーマンス測定 (IOMETERによるベンチ)	リード / ライト シーケンシャル アクセス リード / ライト ランダム アクセス リード / ライト シーケンシャル (Qd ,Blk) リード / ライト ランダム (Qd ,Blk)
書き込み寿命試験	SSDの書き込み寿命の耐久試験
電源 ON / OFF 試験	SSDの電源 ON / OFF の耐久試験
自動レポートニング	試験結果のレポートを自動作成
簡易試験編集	複雑な設定を簡易画面から編集

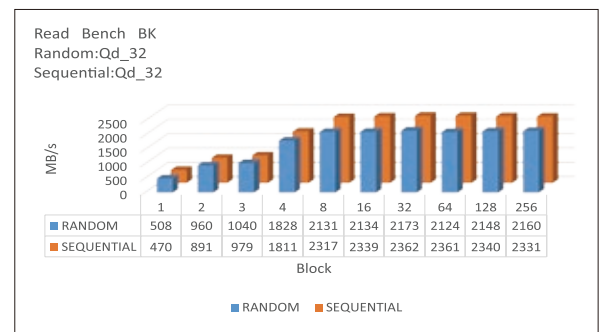
Model D050-NVMe 測定結果

複雑な試験設定を簡易画面から編集して実行することができ、測定結果は自動的にレポート作成されます。

● 全エリアのリードベンチグラフ



● Qd固定の転送ブロック変数の3Dグラフ



● 転送ブロック固定のQd変数の3Dグラフ

